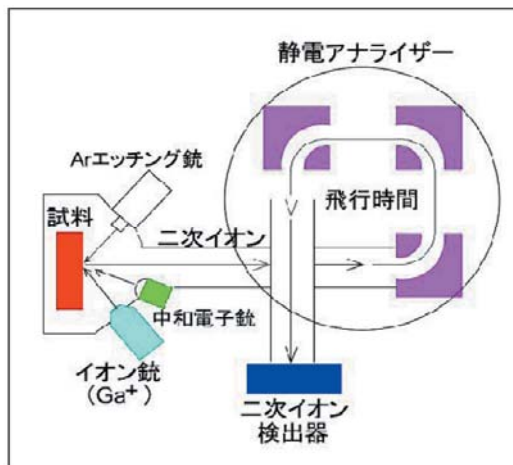


# 飛行時間型二次イオン質量分析装置

Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometer (TOF-SIMS)

ULVAC・PHI社製 TRIFT-III



物質にイオンを照射し、発生する二次イオンの質量を検出器までの飛行時間の差で検出し、固体表面（無機・有機）のナノレベルの情報を得る

1. 機器名称 飛行時間型二次イオン質量分析装置
2. 機器分類 質量分析
3. 担当部署 理工学部 ナノ物質工学科
4. 装置担当者 河村 正昭
5. 導入年度 2004年
6. 型式 ULVAC・PHI社 TRIFT-III
7. 仕様・性能 一次イオン銃;  $1^\circ$  扇式 Au 液体金属付、 $6.7 \times 10^{-8}$  Pa 以下、質量分解能;  $28\text{Si}$  ( $5000\text{M}/\Delta\text{M}$  以上)、空間分解能;  $100\text{nm}$  以下、中和銃; 低エネルギー  $1^\circ$  扇式イオン銃、 $7^\circ$  扇用イオン銃; Ar イオン銃
8. 機器の開放状況（該当する区分を選択して下さい。）
  - ・共同研究のみ
9. 利用上の注意点
10. 主な使用事例